Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0404U002475

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-06-2004

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Михайлов Сергій Ростиславович
2. Mihajlov Sergej Rostislavovich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 05.27.02

Назва наукової спеціальності: Вакуумна, плазмова та квантова електроніка

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 14-06-2004

Спеціальність за освітою: 7.090803

Місце роботи здобувача: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження: 03056, м.Київ, пр.Перемоги, 37

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д26.002.08

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження: 03056, м.Київ, пр.Перемоги, 37

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 47.29.39

Тема дисертації:

1. Поліпшення параметрів рентгеноскопічних систем неруйнівного контролю на основі електронно-променевих приладів

2. Improving of X-ray fluoroscopy systems parameters based on non-destructive testing of electron-beam device

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена поліпшенню параметрів рентгеноскопічних систем неруйнівного контролю, таких, як відносної чутливості контролю та граничної товщини контрольованих об'єктів, за рахунок переведення передавальних електронно-променевих приладів в режим регульованої тривалості накопичення сигналів на мішені. Запропонована методика моделювання тіньового рентгенівського зображення контрольованого об'єкта. Розроблені математичні моделі перетворення сигналів в передавальних електронно-променевих приладах рентгенівського та оптичного діапазонів випромінювання. Визначені залежності відносної чутливості контролю, відношення сигнал/шум та роздільної здатності систем від тривалості накопичення, параметрів рентгенівського випромінювання, параметрів і режиму роботи електронно-променевих приладів. Проведені експериментальні дослідження рентгеноскопічних систем, працюючих в режимі регульованої тривалості накопичення

2. The work is devoted to improving of X-ray fluoroscopy systems parameters based on non-destructive testing, such as relative control sensitivity and range of inspected thicknesses of objects, by using the mode of adjustable duration of accumulation of signals on the target for transmitting electron-beam device. The simulation technique for the shadow x-ray image of inspected object has been proposed. The mathematical models of signals transformation in transmitting x-ray and optical electron-beam devices are developed. The relations for the relative control sensitivity, for signal-to-noise ratios and for resolving powers of systems from duration of accumulation, parameters of a X-radiation, parameters and operation mode of electron-beam devices are defined. Experimental researches for X-ray fluoroscopy systems in a mode of adjustable duration of signals accumulation with various X-ray sources are carried out

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Денбновецький Станіслав Володимирович

2. Denbnovetskij Stanislav Vladimirovich

Кваліфікація: д.т.н., 05.27.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Воронов Сергій Олександрович

2. Воронов Сергій Олександрович

Кваліфікація: д.т.н., 05.27.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дзюба Валентин Павлович

2. Дзюба Валентин Павлович

Кваліфікація: к.т.н., 05.27.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Петренко Анатолій Іванович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Петренко Анатолій Іванович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.